



ID de Contribution: 2

Type: Non spécifié

## **Nouvelles méthodes d'analyse des détecteur silicium pour étudier les effets des dommages d'irradiation sur les performances des détecteurs de pixels (SIMS et TLM)**

*vendredi 11 juin 2021 09:25 (25 minutes)*

**Orateur:** SALEEM (SOLEIL), Tasneem (SOLEIL Synchrotron)